

## 本期封面



1999年6

栏目:

DOI:

论文题目: 软X射线质量吸收系数的测定

作者姓名: 尚玉华, 刘志东, 徐乐英

工作单位: 中国科学院金属研究所

通信作者:

通信作者Email:

文章摘要: 制备了厚度为25-225nm的C、Al、Ti、Cu、Nb、Mo、Ag、Ta和W 9种纯元素薄膜样品,用化学分析方法测定了薄膜的质量厚度 $\rho z$ ,并用电子探针测定了软X射线 $CK\alpha$ 、 $BK\alpha$ 的出射强度 $I_0$ 和穿过薄膜后的强度 $I$ .根据X射线通过物质时的指数衰减定律: $I/I_0 = e^{-\mu\rho z}$ ,得到了这9种纯元素对 $CK\alpha$ 、 $BK\alpha$ 辐射的质量吸收系数 $\mu$ ,并与以往的数据进行比较.

关键词: 质量吸收系数, 软X射线, 薄膜, 质量厚度

分类号:

关闭